

奈良先端科学技術大学院大学マテリアル研究プラットフォームセンター共用
推進事業実施要領

令和6年3月27日
学 長 裁 定

(趣旨)

第1条 この要領は、奈良先端科学技術大学院大学が有する研究設備等の整備・共用の推進に関する規程（令和6年規程第4号。以下「共用規程」という。）第7条の規定に基づき、マテリアル研究プラットフォームセンター（以下「センター」という。）が保有する研究設備・機器（以下「共用設備」という。）の共同利用（以下「共用」という。）を推進する事業（以下「本事業」という。）に関し、必要な事項を定める。

(共用の推進)

第2条 本事業は、共用設備の共用を推進するため、共用規程第5条第1項各号に掲げる支援業務を行う。

(利用条件)

第3条 共用設備の共用を推進するに当たっては、共用規程第2条に定める目的の下、本学の研究及び教育に支障がなく、かつ、共用設備を利用しようとする者の要請に応え、又は健全な事業活動に資すると認められる場合に限り行うものとする。

(利用資格)

第4条 共用設備を利用することができる者は、次に掲げるものとする。

- (1) 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）の教職員及び学生（特別研究学生、研究生及び特別学修生を含む。）
- (2) 本学以外の学術研究機関に所属する研究者及び有識者
- (3) 企業等に所属する研究者及び有識者
- (4) その他マテリアル研究プラットフォームセンター長（以下「センター長」という。）が認める者

(利用責任者)

第5条 共用設備を利用する場合は、共用設備の利用事案ごとに利用責任者を置かなければならない。

- 2 利用責任者は、当該利用事案について、共用設備を利用する者（以下「利用者」という。）及び共用設備の利用状況を管理しなければならない。
- 3 利用責任者は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをもって充てる。ただし、共用設備を利用する本人が当該各号に定

めるものに該当する場合は、当該本人を利用責任者とすることができる。

- (1) 前条第1号に定める者 所属する研究室の教員
- (2) 前条第2号から第4号までに定める者 共用設備を利用して行う研究の責任者

(利用申請)

第6条 第4条第1号に定める者が共用設備を利用する場合は、利用する共用設備に応じて、センター長への申請等の必要な手続を経なければならない。

- 2 第4条第2号から第4号までに定める者が共用設備を利用する場合は、センター長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用審査)

第7条 センター長は、前条第2項に定める利用申請について、共用設備の利用の可否を決定し、当該決定を申請者に通知するものとする。

(共用設備及び利用料金)

第8条 利用者に提供する共用設備は、別表のとおりとする。

- 2 前項の共用設備の利用料金は、共用規程第5条第2項の定めに基づき、別表に定める額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額（以下「直接経費」という。）並びに共用設備の利用に伴う本学の管理等に必要な間接経費として直接経費の30パーセントに相当する額の合算額とする。
- 3 前項の場合において、特に必要があると認められるときは、センター長は利用料金の一部又は全額を免除することができる。
- 4 利用料金は、原則として、前納とする。ただし、センター長が認めた場合は、共用設備の利用後に利用料金を納付することができる。
- 5 本学は、原則として、納付された利用料金は利用者に返還しない。

(利用報告)

第9条 利用者は、共用設備の利用を終了した年度の年度末までに、利用内容をセンター長に報告しなければならない。ただし、センター長が不要と認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、共用設備の利用に関し、センター長が指示する事項及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 承認された利用目的以外に利用しないこと。
- (2) 共用設備を第三者に利用させないこと。
- (3) 共用設備に特別の工作をし、又は現状を変更しないこと。ただし、センター長が認める場合を除く。
- (4) 共用設備の保全に努めること。

- (5) 共用設備に異常がある場合は、直ちに利用責任者及び共用設備の管理者に報告し、その指示に従うこと。
- (6) 事故等の危険を引き起こすおそれがある行為を行わないこと。
- (7) その他本学の研究及び教育に支障となる行為を行わないこと。

(中止等)

第11条 センター長は、前条に定める遵守事項のいずれかに違反する行為若しくは状態がある場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、共用設備の利用の承認を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

- (1) 利用者がこの要領その他の学内規則及び法令に違反し、又は違反するおそれがあるとセンター長が認めるとき。
 - (2) 利用者が利用申請等の手続において虚偽の報告をしたとき。
 - (3) 利用者が利用料金を本学が指定する期日までに納付しないとき。
 - (4) 本学の管理上の事由により、共用設備の利用に支障があるとセンター長が認めるとき。
- 2 本学は、前条に定める遵守事項及び前項第1号から第3号までの事由により、共用設備の利用の承認を取り消し、又はその利用を中止させたことにより利用者に生じた損害については、その責を負わない。
- 3 本学及び利用者は、天災その他本事業の遂行上やむを得ない事由がある場合、相手方と協議の上、共用設備の利用を中止し、又は利用期間を延長することができる。この場合において、本学は、その利用を中止させたことにより利用者に生じた損害については、その責を負わない。

(原状回復)

第12条 利用者は、共用設備の利用を終えたとき（前条第1項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を中止させた場合を含む。）は、直ちに原状に回復するとともに、共用設備の管理者の検査を受けなければならない。ただし、センター長が不要と認めた場合は、この限りでない。

(秘密保持)

第13条 センターに所属する教職員及び利用者は、共用設備の利用により、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た技術上若しくは営業上の一切の情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの（以下「秘密情報」という。）を本事業以外の目的に使用してはならない。

- (1) 「秘」等秘密である旨の表示を付した図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示される情報
- (2) 口頭で開示される情報であって、開示の際に秘密である旨明示され、開示後15日以内に開示内容が記載され、かつ、「秘」等秘密の旨の表示を付した文書で提供された情報
- (3) 試料、サンプルその他物で開示される情報であって、開示の際に秘密であ

- る旨明示され、開示後15日以内に当該物を特定できる内容が記載され、かつ、「秘」等秘密の旨の表示を付した文書が提供された当該物に係る情報
- 2 センターに所属する教職員及び利用者は、秘密情報を開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
- (1) 開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
 - (2) 開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
 - (3) 開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
 - (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発し、又は取得していたことを証明できる情報
 - (6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報

(事故補償の免責等)

- 第14条 利用者(第4条第2号から第4号までに定める者をいう。以下この条において同じ。)が、共用設備の利用に当たって事故、災害等に遭遇した場合は、当該利用者が所属する学術研究機関又は企業等が、従業員に適用する補償制度をもって補償することを原則とする。ただし、当該事故、災害等が、本学の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
- 2 利用者が共用設備の利用に当たって提出した実験用試料等を滅失し、又は毀損した場合は、本学の責めに帰すべき事由によるものを除き、本学はその責を負わない。
- 3 利用者は、共用設備の利用によって第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と負担により解決するものとし、本学はその責を負わない。

(損害賠償)

- 第15条 利用者は、故意又は過失(第4条第1号に定める者にあつては、故意又は重大な過失)により共用設備を滅失し、又は毀損した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(存続条項)

- 第16条 第13条から第15条までの規定は、利用者が共用設備の利用を終了した後も、各条項の遵守に必要な限りにおいて引き続き効力を有するものとする。

(会計)

- 第17条 本事業の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- 2 直接経費による収入は、本事業において利用者に提供する共用設備の維持

管理等に資するもののみを当該収入のあった会計年度の収益として計上し、これ以外のは翌会計年度に繰り越し、共用規程第3条第1項の基本方針に基づいて措置する共用設備の整備等に充当することができる。

(雑則)

第18条 この要領に定めのない事項については、本学が定める規則等の定めるところによるほか、センター長が別に定める。

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年7月1日から施行する。

各支援業務及び共用設備等における利用料金一覧

業務	分類	共用設備等 (型番等)	利用料金(円) (消費税及び地方消費税 を除く。)	試験単位等 (標準測定時間)
技術相談			無料	
技術代行	顕微鏡装置	200kV透過電子顕微鏡 (200kV-TEM) (※1) (JEM-2200FS)	300,000	1検体 (4時間以内)
		走査透過電子顕微鏡 (STEM) (HD-2700)	374,000	1検体 (4時間以内)
		超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (SU9000)	109,600	1検体 (4時間以内)
		低真空分析走査電子顕微鏡 (SU6600)	77,400	1検体 (4時間以内)
		多機能分析走査電子顕微鏡 (JSM-IT800 (SHL))	120,000	1検体 (4時間以内)
		微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (NE4000)	540,000	1検体 (4時間以内)
		表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 (NanoWizard ULTRA Speed2)	93,000	1検体 (4時間以内)
		走査プローブ顕微鏡 (SPM) (SPA400)	21,200	1検体 (2時間以内)
	質量分析計	二重収束型質量分析計 (Sector-MS) (※2、※3) (JMS-700 MStation)	16,000	1検体 (1時間以内)
		LC/TOFMS飛行時間型質量分析計 (ESI-TOFMS) (※4) (JMS-T100LC AccuTOF)	14,800	1検体 (1時間以内)
		LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計 (※4、※5) (AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	14,800	1検体 (1時間以内)
		マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 (MALDI-TOFMS) (autoflex II)	9,400	1検体 (1時間以内)
		マトリックス支援レーザー脱離イオン化Spiral飛行時間型質量 分析計 (MALDI-Spiral-TOFMS) (JMS-S3000)	14,400	1検体 (1時間以内)
		DART質量分析計 (DART-MS) (JMS-Q1000TD)	13,900	1検体 (1時間以内)
	X線解析装置	X線構造解析装置 (※6) (SmartLab9kW/IP/HY/N)	40,000	1検体 (4時間以内)
		微小単結晶X線構造解析装置 (VariMax RAPID RA-Micro7)	218,000	1検体 (20時間以内)
		高性能単結晶X線自動解析装置 (XtaLAB Synergy-R/Cu)	245,000	1検体 (15時間以内)
	核磁気共鳴装置 及び 電子スピン共鳴装置	600MHz NMR (※77) (JNM-ECA600)	10,400	1検体 (0.5時間以内)
		500MHz NMR (※7、※8) (JNM-ECZ500R)	7,800	1検体 (0.5時間以内)
		400MHz 固体・溶液NMR (※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	7,800	1検体 (0.5時間以内)
		電子スピン共鳴装置 (ESR) (JES-FA100N)	19,200	1検体 (4時間以内)
	表面分析装置	電子線マイクロアナライザ (EPMA) (EPMA1610)	120,000	1検体 (4時間以内)
		多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (PHI 5000 VersaProbe II)	102,600	1検体 (8時間以内)

	光学測定装置	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	30,000	1 検体 (4 時間以内)
		円二色性分散計 (CD) (J-820)	27,000	1 検体 (3 時間以内)
		ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	50,400	1 検体 (6 時間以内)
		分光エリプソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	44,400	1 検体 (2 時間以内)
		光ダイナミクス分光装置 (※10) (Mira 900) (KEC-160) (C10910-04)	110,400	1 検体 (8 時間以内)
	元素分析装置	全自動元素分析装置 (2400 II CHNS/O)	5,600	1 検体 (0.5 時間以内)
	物性測定装置	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	36,000	1 検体 (4 時間以内)
		大気中光電子分光装置 (AC-3)	17,800	1 検体 (1 時間以内)
		分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	30,000	1 検体 (2 時間以内)
	膜厚測定装置	微細形状測定装置 (ET200)	7,700	1 検体 (1 時間以内)
技術補助		技術補助講習 (※11)	10,000	1 講習 (4 時間以内)
		一般技術補助	10,000	1 時間
機器利用 (※13)	顕微鏡装置	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (SU9000)	27,400	1 時間
		低真空分析走査電子顕微鏡 (SU6600)	19,350	1 時間
		多機能分析走査電子顕微鏡 (JSM-IT800 (SHL))	30,000	1 時間
		微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (※12) (NE4000)	135,000	1 時間
		表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 (NanoWizard ULTRA Speed2)	23,250	1 時間
		走査プローブ顕微鏡 (SPM) (SPA400)	5,300	1 時間
	質量分析装置	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 (MALDI-TOFMS) (※13) (autoflex II)	9,400	1 時間
		DART質量分析計 (DART-MS) (JMS-Q1000TD)	13,900	1 時間
	核磁気共鳴装置	500MHz NMR (※7、※8) (JNM-ECZ500R)	15,600	1 時間
		400MHz 固体・溶液NMR (※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	15,600	1 時間
	表面分析装置	多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (PHI 5000 VersaProbe II)	12,825	1 時間
	光学測定装置	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	7,500	1 時間
		円二色性分散計 (CD) (J-820)	9,000	1 時間
		ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	8,400	1 時間
		分光エリプソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	22,000	1 時間
物性測定装置	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	9,000	1 時間	
	大気中光電子分光装置 (AC-3)	17,800	1 時間	

	分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	15,000	1時間
膜厚測定装置	微細形状測定装置 (ET200)	7,700	1時間

・利用時間に装置の立ち上げ・立ち下げに係る時間を含む。また、利用時間は原則として平日の9時から17時までの間とする。

・技術代行において1検体当たりの標準測定時間を超過する場合又は特別な観察若しくは分析に必要な処理を要する場合は、規定の利用料金に加え、別途実費相当額を利用料金として徴収することがある。

- (※1) EELS、電子回折法及びクライオ電子顕微鏡法による測定はできない。
- (※2) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。
- (※3) GC利用の場合は、再現性確認のために2回にわたって測定を行うことから、1検体当たり2倍の利用料金を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として1測定当たり別途3検体分の利用料金を徴収する。
- (※4) 本学のカラムを利用する場合は、1検体当たり別途1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）を徴収するとともに、測定に時間を要するため1検体当たり3倍の利用料金を徴収する。また、本学で移動相を用意する場合は、1検体当たり別途500円（消費税及び地方消費税を除く。）を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として、LC条件提示が有る場合は1測定当たり別途4検体分、LC条件提示が無い場合は1測定当たり別途8検体分の利用料金を徴収する。
- (※5) CSI測定の場合は、装置の起動に係る料金として1測定当たり別途1検体分の利用料金を徴収する。
- (※6) 1測定当たりの測定時間は最大4時間（装置の立ち上げに係る時間としての1時間を含む。）とし、これを超える場合は、以降3時間ごとに1検体分の利用料金を徴収する。また、オプションユニットを利用して測定した場合は、その測定の種類に応じ、条件調整に係る料金として、1測定当たり別途次の利用料金を徴収する。
 - ①CuK α 1単色化用Ge(220)2結晶の場合：1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ②環境雰囲気ユニットを用いた測定の場合：1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ③逆格子マップ測定の場合：10,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ④インプレーン測定の場合：5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ⑤2DXRD測定の場合：5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ⑥昇温測定の場合：10,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
- (※7) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、利用者が用意する。
- (※8) 1測定当たりの測定時間は、最大3時間とする。
- (※9) 液体サンプルについては技術代行又は機器利用、固体サンプルについては技術代行のみ可能とする。
- (※10) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体当たりの利用料金とする。
- (※11) 機器利用の利用者は、あらかじめ、機器操作に関する講習として技術補助講習を受講することを基本とする。
- (※12) 本学のプローブを利用する場合は、1プローブ当たり別途20,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料金を徴収する。
- (※13) 機器利用において、プレートについては利用者が持込み、サンプル等のプリパレーションについては利用者が用意した後に利用することを基本とする。なお、本学のプレートを利用し、サンプル等のプリパレーションを本学で用意する場合は、1測定当たり別途5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料金を徴収する。

第8条第3項の規定に基づく各支援業務及び共用設備における利用料金一覧

業務			分類	共用設備 (型番)	利用料金(円) (消費税及び地方消費税を除く。)	試験単位等 (標準測定時間)
技術相談					無料	
技術 代行	技術 補助	機器 利用				
○	○	○	顕微鏡装置 及び 試料作成装置	200kV透過電子顕微鏡 (200kV-TEM) (JEM-2200FS)	800	60分間
○				走査透過電子顕微鏡 (STEM) (HD-2700)	1,480	60分間
	○	○		超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (SU9000)	300	30分間
	○	○		低真空分析走査電子顕微鏡 (SU6600)	210	30分間
	○	○		多機能分析走査電子顕微鏡 (IT800 (SHL))	300	30分間
○	○	○		微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (NE4000)	1,360	1回
○	○	○		表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 (NanoWizard ULTRA Speed2)	300	30分間
	○	○		走査プローブ顕微鏡 (SPM) (SPA400)	200	1検体
○				集束イオンビーム加工装置 (FIB) (FB2200)	350	60分間
○				アルゴンイオンミリング装置 (Model 691)	200	1検体
○				クライオ試料作製装置 (EM-CPC)	200	1検体
○				マイクローム (クライオスタット付) (Ultracut R)	200	1検体
○				二重収束型質量分析計 (Sector-MS) (JMS-700 MStation)	240	10分間
○				LC/TOFMS飛行時間型質量分析計 (ESI-TOFMS) (JMS-T100LC AccuTOF)	240	10分間
○			LC-TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計 (AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	240	10分間	
○	○	○	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 (MALDI-TOFMS) (autoflex II)	240	10分間	
○			マトリックス支援レーザー脱離イオン化Spiral飛行時間型質量分析計 (MALDI-Spiral-TOFMS) (JMS-S3000)	240	10分間	
○	○	○	DART質量分析計 (DART-MS) (JMS-Q1000TD)	240	10分間	
○	○	○	X線解析装置	X線構造解析装置 (SmartLab9kW/IP/HY/N)	150	30分間
○	○	○		微小単結晶X線構造解析装置 (VariMax RAPID RA-Micro7)	150	30分間
○	○	○		高輝度X線小角散乱装置 (NanoViewer)	50	30分間
○	○	○		高性能単結晶X線自動解析装置 (XtaLAB Synergy-R/Cu)	200	30分間
○	○	○	核磁気共鳴装置 及び 電子スピン共鳴装置	600MHz NMR (JNM-ECA600)	30	10分間
○	○	○		500MHz NMR (JNM-ECZ500R)	30	10分間
○	○	○		400MHz 固体・溶液NMR (※1) (JNM-ECX400P)	30	10分間
○	○	○		電子スピン共鳴装置 (ESR) (JES-FA100N)	120	30分間
○			表面分析装置	電子線マイクロアナライザ (EPMA) (EPMA1610)	180	30分間
○	○	○		多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (PHI 5000 VersaProbe II)	210	30分間
○	○	○	光学測定装置	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	60	30分間
○	○	○		円二色性分散計 (CD) (J-820)	160	60分間
○	○	○		ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	60	30分間
○	○	○		分光エリブソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	140	30分間
○	○	○		光ダイナミクス分光装置 (Mira 900) (KEC-160) (C10910-04)	220	30分間

○	○	○	元素分析装置	蛍光X線元素分析装置 (MESA-500W)	50	30分間
○				全自動元素分析装置 (2400 II CHNS/O)	160	1 検体
○				誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICPM-8500)	1,100	60分間
○				マイクロ波プラズマ微量元素質量分析装置 (P-6000)	1,100	60分間
	○	○	物性測定装置	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	120	60分間
	○	○		熱/電気物性評価装置 (物性評価装置: PPMS) (EverCool II)	50	30分間
○	○	○		大気中光電子分光装置 (AC-3)	360	30分間
	○	○		分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	90	30分間
○			クリーンルーム	TFE電子ビーム描画装置 (ELS-7500)	90	30分間
	○	○		露光装置 (MA-10, PrA II)	30	30分間
	○	○		複合酸化物薄膜形成装置 (PSV-2000)	40	30分間
	○	○		高純度金属スパッタ装置	60	30分間
	○	○		微細形状測定装置 (ET200)	20	10分間
	○	○		洗濯機	100	1 回
	○	○	その他	リークディテクタ	750	1 日間

・この表は、第8条第3項の規定に基づき、センター長により一部を免除した利用料金（間接経費を要しない）であり、第4条第1号に規定する利用資格を有する者がその適用を受けるものとする。

（※1） 液体サンプルについては技術代行又は機器利用を、固体サンプルについては技術代行のみを可能とする。